



بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی



مطالعه ی خواص کانونی مدل ارتقاء یافته ای از تیغه ی منطقه ای فرنل با قدرت تفکیک تصحیح شده

آرش ثباتیان ، الناز پیرضیائی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده - به علت محدودیت تکنیکی در ساخت تیغه های منطقه ای فرنل با قطرهای بزرگتر، این قطعات قابل تولید نیستند. در این کار روشی را معرفی می کنیم که در آن با ثابت بودن فاصله ی کانونی، تیغه ی منطقه ای با قطر بزرگتر را تولید کرده که منجر به ایجاد تیغه ی منطقه ای تصحیح یافته می شود که قدرت تفکیک بالاتری نسبت به قطعه ی قبلی دارد.

کلید واژه - پرتو گاوسی، توزیع شدت، تیغه ی منطقه ای فرنل، حلقه های روشن، قدرت تفکیک

Study of the focal properties of Fresnel zone plate's enhanced model with corrected resolution

Arash Sabatyan , Elnaz Pirziaei

Department of Physics, Faculty of Science, Urmia university, Urmia

Abstract- Due to technical limitations in production of Fresnel zone plate with larger diameter, these parts are not producible. In this article, we introduce a method in which, with fixed focal length produces a zone plate with larger diameter, which leads to modified Fresnel zone plate that its resolution is higher than the previous piece.

Keywords: Gaussian beam, Intensity Distribution, Fresnel zone plate, bright rings, Resolution

۱- مقدمه

استفاده از تقریب بسل، معادله‌ی میدان پراشی در نقطه‌ی R به صورت زیر بدست می‌آید:

$$U_n(R) = \frac{2f}{f_n} \exp \left[jk \left(f_n + \frac{R^2}{2f_n} \right) \right] J_0 \left(\frac{kr_n}{f_n} R \right) \sin \left(\frac{kd_n}{2f_n} \right). \quad (2)$$

d_n نیم‌پهنای n امین حلقه‌ی روشن در مختصات s است. به‌طوریکه $s = r^2$. b_n, a_n به‌ترتیب شعاع لبه‌ی پایینی و بالایی n امین حلقه‌ی روشن است و $a_n^2 = s_n - d_n$ و $b_n^2 = s_n + d_n$ به‌طوریکه $s = s_n$ نقطه‌ی میانی انتگرال در مختصات s است. برای شرایط خاص $U_n(0)$ در شعاع $R=0$ مقدار میدان به صورت زیر است:

$$U_n(0) = \frac{2f}{f_n} \exp(jkf_n) \sin \left(\frac{kd_n}{2f_n} \right). \quad (3)$$

شروط تداخل سازنده و ویرانگر برای نوارهای روشن MFZP به ترتیب به صورت زیر است:

$$f_n = f + m_n \lambda \quad \sin \left(\frac{kd_n}{2f_n} \right) > 0, \quad (4)$$

$$f_n = f + \left(m_n + \frac{1}{2} \right) \lambda \quad \sin \left(\frac{kd_n}{2f_n} \right) < 0,$$

m_n مقدار صحیح نامنفی است. ایجاد یک نقطه‌ی کانونی گاوسی ارزشمند است چرا که مزیت‌هایی از جمله داشتن بیشینه‌های ثانویه، تقارن کروی، عمق کانونی زیاد و کیفیت پرتویی بالا را دارد. بنابراین میدان پراشی کل در صفحه‌ی کانونی با پهنای پرتویی $2F/(K\sigma)$ به صورت زیر است:

$$U(R) \approx \alpha \sigma^2 \exp \left[- \left(\frac{\sigma k R}{2F} \right)^2 \right] \quad (5)$$

این رابطه صراحتاً نشان دهنده یک پرتو گاوسی است. برای برقراری رابطه‌ی بالا، شرط زیر باید برای هر حلقه‌ی روشن صدق کند:

$$\beta D_n f_n \exp \left[- (s_n - s_1) / \sigma^2 \right] / (D_1 f_1) \leq 1 \quad (6)$$

همچنین رابطه‌ی $\exp(-A^2/\sigma^2) \ll 1$ باید برقرار باشد. بنابراین $\beta = 0.96$ و $\sigma = R/2$. حال برای طراحی تیغه‌ی منطقه‌ای فرنل تصحیح یافته، تعداد کل حلقه‌ها به سه ناحیه تقسیم شده و برای حلقه‌های روشن در هر

کانونی کردن و تصویربرداری اشعه‌ی ایکس، دارای کاربرد های زیادی در علم فیزیک و زندگی روزمره است. از جمله کاربرد های آن می‌توان به اسپکتروسکوپی، نانولیتوگرافی، پزشکی، صنعت و میکروسکوپی با وضوح بالا و ... اشاره کرد. برای رسیدن به این هدف، نمی‌توان از عدسی‌های شکستی استفاده کرد. زیرا در ساخت این عناصر، از مواد جامد استفاده شده است و این مواد در این ناحیه‌ی طول موجی، تحت سه مکانیزم فتوالکتریک، اثر کامپتون و جفت‌شدگی باعث جذب پرتو می‌شوند. بنابراین برای رفع این مشکل، به‌کارگیری عدسی‌های پراشی که بر پایه‌ی اصل پراش طراحی و ساخته می‌شوند، پیشنهاد شده است [۱]. طرح های مختلفی برای جایگزینی عدسی‌های پراشی به جای عدسی‌های شکستی ارائه شده است. اولین نمونه از این عناصر، تیغه‌ی منطقه‌ای فرنل است. این عنصر به دلیل وزن و حجم کم، ارزان بودن، ساخت آسان، انعطاف‌پذیری و قابلیت ترکیب با سایر عناصر اپتیکی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اما قدرت تفکیک این عنصر پراشی، به‌وسیله کوچکترین ساختاری که می‌توان در لیتوگرافی ساخت (۴۰-۲۰ نانومتر) محدود می‌شود [۲]. برای رفع این عیب و بدست آوردن پرتو گاوسی با کمترین پهنای و ماکزیمم مرکزی با شدت بالا، طرح جدیدی از تیغه‌ی منطقه‌ای فرنل در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است که در آن پهنای نوارهای روشن تغییر یافته است. بنابراین این قطعه، تیغه‌ی منطقه‌ای فرنل تصحیح یافته^۱ نامیده می‌شود.

۲- تئوری و شبیه سازی

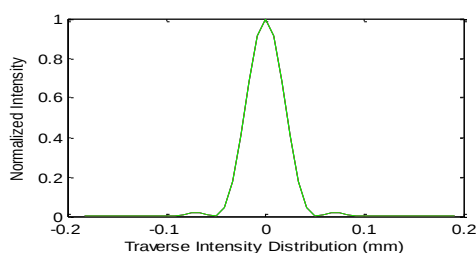
یک MFZP با N حلقه‌ی روشن هم مرکز در نظر گرفته می‌شود. (شکل ۱) از انتگرال پراش ریلی - سامرفیلد می‌توان نوشت [1]:

$$U_n(R) = \frac{1}{\lambda} \iint_{A_n} \frac{f}{\rho^2} \exp(jk\rho) r dr d\theta, \quad (1)$$

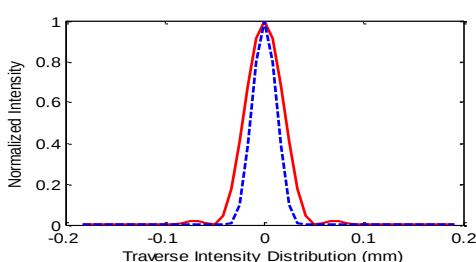
به‌طوریکه $k = 2\pi/\lambda$ ، طول موج، A_n مساحت n امین حلقه‌ی روشن و $\rho = [f^2 + R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\theta - \phi)]^{1/2}$ است. با

¹ Modified Fresnel zone plate (MFZP)

تغییر داده و این بار به صورت ۸و۶،۴ در نظر می‌گیریم. توزیع شدت عرضی برای این نمونه در مقایسه با حالت قبلی، در شکل ۴ رسم شده است.

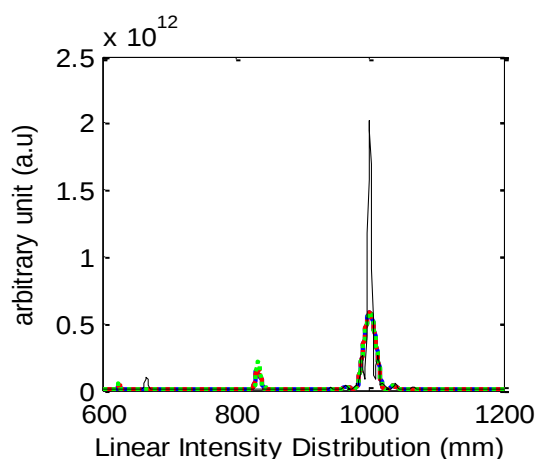


شکل ۳: توزیع شدت عرضی در صفحه کانون (میلی‌متر)



شکل ۴: توزیع شدت عرضی در صفحه کانون (میلی‌متر). نمودار خط‌چین مربوط به پهنای ۸و۶،۴ و نمودار با خط صاف مربوط به پهنای ۱۰و۶،۴ MFZP است. پهنای این پرتوگوسی به ترتیب ۱۰۰ و ۱۰۰ میکرومتر است.

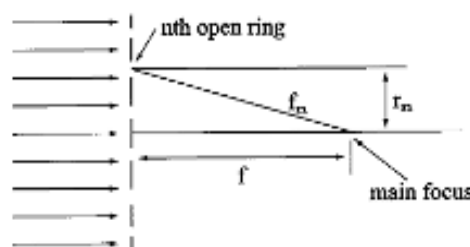
در شکل ۵، نمودار توزیع شدت طولی این ۴ نمونه باهم مقایسه شده است. نمودار با رنگ قرمز، آبی و سبز مربوط به پهنای ۴،۶ و ۱۰ و نمودار مشکی رنگ مربوط به پهنای ۴،۶ و ۸ MFZP است. شدت برای نمونه‌ی با پهنای ۴،۶ و ۸ بیشتر از سایر نمونه‌ها است.



شکل ۵: توزیع شدت طولی در صفحه کانون (میلی‌متر)

شکل ۶ نمودار توزیع شدت عرضی مربوط به FZP و MFZP با پهنای ۴،۶ و ۸ را نشان می‌دهد. برای هر دو

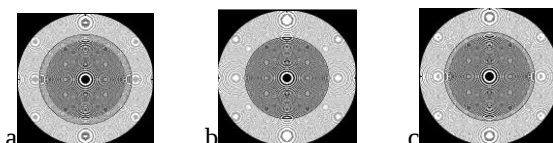
ناحیه پهنای مشخصی در نظر گرفته می‌شود به این صورت که ضریب صحیحی از پهنای نوارهای روشن FZP^۲ باشند. پهنای باریک‌ترین نوار که همان آخرین نوار ناحیه ۱ است، به علت محدودیت چاپ، ۴۰ میکرومتر در نظر گرفته می‌شود.



شکل ۱: طرحی از یک تیغه‌ی منطقه‌ای فرنل تصحیح یافته

۳- کار آزمایشگاهی

شبیه سازی کار توسط نرم‌افزار MATLAB انجام شد. در ابتدا نمونه‌هایی از MFZP به قطر ۲۵ میلی‌متر با فاصله‌ی کانونی ۵۰۰ میلی‌متر و ۲۴۷ حلقه‌ی روشن شبیه‌سازی شد. با تقسیم کل نوارهای روشن به سه ناحیه و تعیین تعداد نوارهای مشخص برای این سه ناحیه، نمونه‌های طراحی شده به صورت زیر حاصل شد. سپس لیتوگرافی با دستگاهی با رزولوشن ۲۴۰۰ dpi انجام گرفت. این نمونه‌ها در آزمایشگاه تحت چیدمان خاصی در برابر نور هلیوم- نئون با طول موج ۶۳۲.۸ نانومتر قرار گرفت و در نهایت توزیع شدت حاصل از آنها توسط CCD ثبت شد.

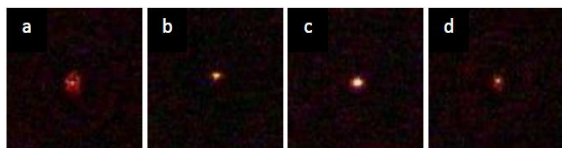


شکل ۲: تصویر مربوط به سه نمونه‌ی شبیه‌سازی شده. تعداد حلقه‌های روشن در سه ناحیه، برای این سه نمونه متفاوت است.

برای هر سه نمونه فاصله کانونی ۵۰۰ میلی‌متر و قطر ۲۵ میلی‌متر است. تعداد حلقه‌های روشن نمونه a برای نواحی ۲، ۱ و ۳ به ترتیب ۴۲، ۱۰ و ۲۷ است. نمونه b ۴۲، ۲ و ۳۲ و نمونه c ۴۲، ۲۱ و ۲۱ نوار روشن برای سه ناحیه دارد. برای این نمونه‌ها پهنای نوارهای روشن به صورت ۴،۶ و ۱۰ در نظر گرفته شده است. نمودار توزیع شدت عرضی این نمونه‌ها در شکل ۳ رسم شده که کاملاً روی هم منطبق شده اند. برای مقایسه، پهنای نوارهای روشن MFZP را

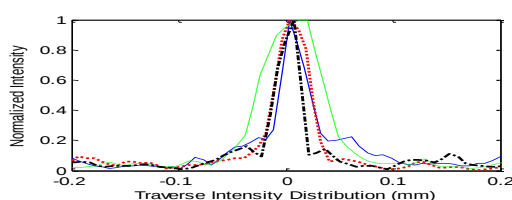
$$^2 W_n$$

شکل ۹، توزیع شدت ثبت شده توسط CCD را برای نمونه‌ها نشان می‌دهد.



شکل ۹: توزیع شدت ثبت شده از نمونه‌ها. a, b و c مربوط به نمونه‌های با پهنای ۱۰ و ۶، ۴ و تصویر d مربوط به نمونه‌ی با پهنای ۸ و ۴ است.

نمودار توزیع شدت عرضی برای نتایج تجربی به صورت زیر بدست می‌آید.



شکل ۱۰: توزیع شدت عرضی در صفحه کانون (میلی‌متر). رنگ مشکی مربوط به پهنای ۸ و ۴، ۶ و ۴ در کار تجربی است که دارای پهنای ۴۴ میکرومتر است. پهنای نمودار آبی رنگ حدوداً ۴۶ میکرومتر است.

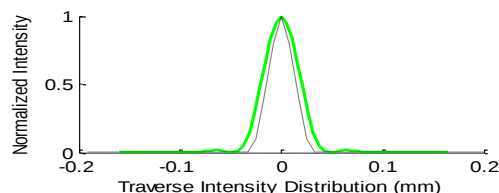
۴- نتیجه‌گیری

نتایج بدست آمده در این مقاله نشان می‌دهد که در یک فاصله کانونی و قطر مشخص، برای پهنای ۸ و ۴، MFZP پهنای پرتو گاوسی کمتر از پهنای ۱۰ و ۶، MFZP است. با مقایسه‌ی FZP و پهنای ۸ و ۴، MFZP مشاهده می‌شود که پهنای ماکزیمم مرکزی در MFZP کاهش یافته است. با کم شدن قطر لکه‌ی مرکزی، کانون تیزتر شده و ماکزیمم‌های ثانویه هم حذف می‌شوند. در نتیجه می‌توان با ثابت بودن فاصله‌ی کانونی، تیغه‌ی منطقه‌ای فرنی با قطر بزرگتر را ساخت به طوریکه قدرت تفکیک بالاتری نسبت به FZP داشته باشد.

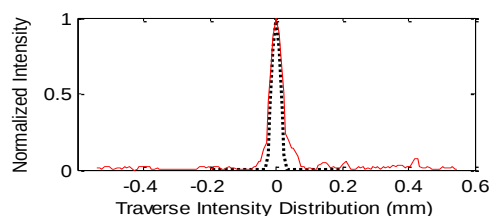
مراجع

- [1] Q. Cao and J. Jahns, *Modified Fresnel zone plates that produce sharp Gaussian focal spots*, J. Opt. Soc. Am. A/Vol. 20, No. 8/August, 1576-1581 (2003).
- [2] E. H. Anderson, V. Boegli, and L. P. Muray, *Electron beam lithography digital pattern generator and electronics for generalized curvilinear structures*, J. Vac. Sci. Technol. B 13, 2529-2534 (1995).

نمونه فاصله‌ی تصویر برداری ۱۰۰۰ میلی‌متر و اندازه‌ی مشخصه‌ی باریک‌ترین نوار روشن ۴۰ میکرومتر درنظر گرفته شده است. قطر نمونه‌ها مقداری است که این هدف را برآورده سازد. بنابراین قطر FZP و MFZP به ترتیب ۱۶ و ۲۵ میلی‌متر فرض شده است.



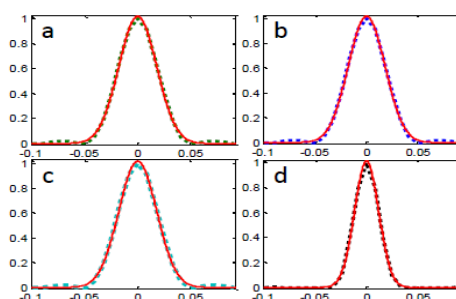
شکل ۶: توزیع شدت عرضی در صفحه‌ی کانون (میلی‌متر). نمودار خط چین مربوط به MFZP با پهنای ۴ و ۸ و نمودار با خط صاف مربوط به FZP است. پهنای این پرتو گاوسی به ترتیب ۶۵ و ۹۶ میکرومتر است.



شکل ۷: توزیع شدت عرضی در صفحه کانون (میلی‌متر). نمودار خط‌چین مربوط به پهنای ۴ و ۸ MFZP درکار شبیه‌سازی و نمودار با خط صاف مربوط به همین نمونه در کار تجربی است.

نمودار بالا نتیجه کار شبیه‌سازی و تجربی را نشان می‌دهد که باتوجه به پهنای ۶۵ میکرومتری، با هم، هم‌خوانی دارند. شکل ۸ تطابق طرح پرتو گاوسی نمونه‌های شبیه‌سازی شده با نمودار پرتوگاوسی تعریف شده بارابطه‌ی زیر را نشان می‌دهد.

$$f(x) = a1 \times \exp(-((x-b1)/c1)^2) \quad (7)$$



شکل ۸: نمودارهای سبز، آبی و مشکی رنگ مربوط به نمونه‌های طراحی شده و نمودارهای قرمز رنگ مربوط به رابطه‌ی بالا هستند. محور افقی توزیع شدت عرضی بر حسب میلی‌متر و محور عمودی شدت نرمالیزه شده را نشان می‌دهد.